

## Musterlösung zu Übungsblatt 9

### Aufgabe 1) p-i-n-Diode

Eine p-i-n-Fotodiode besteht aus einem  $w_i = 10 \mu\text{m}$  langen undotierten Gebiet, das sich zwischen einem p- und n-Gebiet von jeweils  $500 \text{ nm}$  Länge befindet, siehe Figur 1. Die Dotierstoffkonzentrationen im p- und n-Gebiet sind  $n_D = n_A = 5 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ . Die Metallkontakte an beiden Seiten sind ohmsche Kontakte und über den Außenkreis leitend miteinander verbunden. Die Eigenleitungsträgerdichte ist  $n_i = 1,5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$  und es gilt Störstellenerschöpfung.

Der Einfluss der Metallkontakte ist vernachlässigbar. Für die RLZ in den dotierten Bereichen kann die Schottky-Näherung angenommen werden. Die Dielektrizitätskonstante des Halbleiters ist  $\epsilon_r = 12$ , und der Betrieb sei bei Raumtemperatur  $T = 300 \text{ K}$ .

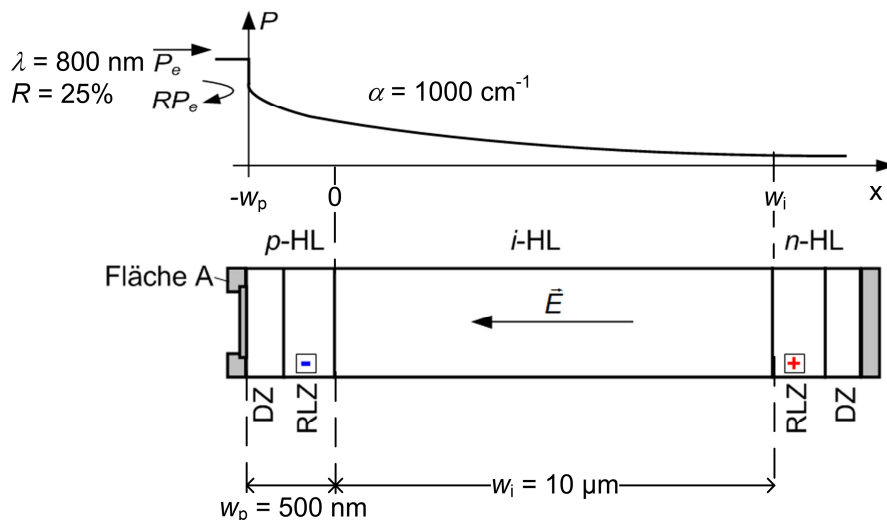


Fig 1: p-i-n-Diode. Oben: Optischer Leistungsabfall über die Tiefe. Unten: Querschnittszeichnung der p-i-n-Diode.

a) Wie groß ist die Diffusionsspannung zwischen n- und p- Gebiet?

**Lösung:**

| p                                                               | i                                                                                          | n                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| $n_A = 5 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$<br>$, \epsilon_r = 12$ | $n_i = 1,5 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ ,<br>$\epsilon_r = 12$<br>$w_i = 10 \mu\text{m}$ | $n_D = 5 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$<br>$, \epsilon_r = 12$ |

mit SSE, Schottky-Näherung

**Ges.:** Die Diffusionsspannung  $U_D$  zwischen n- und p- Gebiet

Interessiert uns nur die Diffusionsspannung zwischen dem n- und p-Gebiet, können wir diese einfach aus der Potentialdifferenz (wie bei der p-n-Diode) durch Einsetzen der gegebenen Größen in (6.13) ermitteln

$$U_D = U_T \ln \left( \frac{n_D \cdot n_A}{n_i^2} \right) = 25.8 \text{ mV} \cdot \ln \left( \frac{25 \times 10^{32}}{2.25 \cdot 10^{20}} \right) = 0.78 \text{ V}$$

- b) Leiten Sie einen formalen Ausdruck für den Verlauf des elektrischen Feldes über der Ortskoordinate  $x$  ( $x = 0$  sei am p-i-Übergang) her. Verwenden Sie dabei die zunächst noch unbekannten Parameter  $l_n$  und  $l_p$  für die Ausdehnungen der Raumladungszone im n- und p-Bereich. Skizzieren Sie den Verlauf des elektrischen Feldes als Funktion des Ortes  $x$ .

**Lösung:**

Geg.:

|               | RLZ-p                              | i                   | RLZ-n                              |
|---------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Ausdehnung    | $-l_p \leq x \leq 0$               | $0 \leq x \leq w_i$ | $d \leq x \leq w_i + l_n$          |
| Trägerdichten | $p, n = 0, n_D^+ = 0, n_A^- = n_A$ | $p, n = 0$          | $p, n = 0, n_D^+ = n_D, n_A^- = 0$ |
| Raumladung    | $\rho = -en_A$                     | $\rho = 0$          | $\rho = +en_D$                     |

**Ges.:**  $E(x)$  mit Skizze, am pi-Übergang sei  $x = 0$

- 1) Wir beginnen im p-Gebiet:

$$E(x) = \frac{1}{\epsilon_0 \epsilon_r} \int \rho(x) dx = \frac{1}{\epsilon_0 \epsilon_r} \int -en_A dx = -\frac{en_A x}{\epsilon_0 \epsilon_r} + C$$

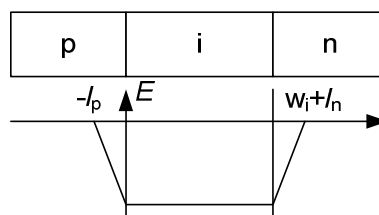
- 2) die Konstante  $C$  ist bestimmt durch die Randbedingung  $E(-l_p) = 0$ :

$$C = -\frac{en_A l_p}{\epsilon_0 \epsilon_r}, \text{ also } E(x) = -\frac{en_A}{\epsilon_0 \epsilon_r} (x + l_p)$$

- 3) im intrinsischen Bereich herrscht eine konstante Feldstärke, die kontinuierlich aus denen an den Orten  $x = 0$  (pi-Übergang) und  $x = d$  (in-Übergang) hervorgeht.

- 4) Der Feldverlauf im n-Gebiet berechnet sich analog zu i.)

|      |                                                        |                                                                                                |                                                              |
|------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Feld | $E(x) = -\frac{en_A}{\epsilon_0 \epsilon_r} (x + l_p)$ | $E_{\max} = -\frac{en_A}{\epsilon_0 \epsilon_r} l_p = -\frac{en_D}{\epsilon_0 \epsilon_r} l_n$ | $E(x) = +\frac{en_D}{\epsilon_0 \epsilon_r} (x - w_i - l_n)$ |
|------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|



- c) Berechnen Sie die Ausdehnungen  $l_n$  und  $l_p$  der beiden Raumladungszone in die dotierten Bereiche? Wie groß ist die maximal auftretenden Feldstärke  $E_{\max}$ ?

**Lösung:**

- 1) Die Raumladungszonenweiten sind wegen der gleichen Dotierungsdichten gleich groß:

$$l_n = l_p. \text{ Die maximale Feldstärke ist } E_{\max} = -\frac{en_A}{\epsilon_r \epsilon_0} l_n = -X \cdot l_n.$$

2) Für die Fläche unter der  $E(x)$ -Kurve ( $= U_D$ ) gilt:

$$U_D = -\frac{1}{2} l_n E_{\max} - w_i \cdot E_{\max} - \frac{1}{2} l_n E_{\max} = -(l_n + w_i) E_{\max} = (l_n + w_i) l_n X$$

$$\Rightarrow l_n^2 + w_i l_n - \frac{U_D}{X} = 0, \text{ mit}$$

$$l_n = -\frac{w_i}{2} \pm \sqrt{\frac{w_i^2}{4} + \frac{U_D}{X}} = 1.0 \text{ nm}$$

Die Raumladungszonen sind also 10 000 Mal kleiner als die i-Zone.

3) Die maximale Feldstärke ist dann

$$E_{\max} = -\frac{en_A}{\epsilon_0 \epsilon_r} l_n = -0.78 \text{ kVcm}^{-1}$$

d) Welcher Vorteil ergibt sich für die p-i-n-Diode als Fotodiode gegenüber einer p-n-Diode ohne i-Schicht?

**Lösung:**

Der felderfüllte Bereich wird durch die intrinsische Schicht verlängert. Dadurch ergeben sich:

- längere Absorptionszone  $\rightarrow$  höherer Quantenwirkungsgrad  $\rightarrow$  größerer Photostrom
- bessere dynamische Eigenschaften (Driftstrom im Absorptionsbereich)
- höhere Durchschlagsfestigkeit

In der undotierten Zone werden durch Lichteinstrahlung ( $P = 100 \mu\text{W}$ ,  $\lambda = 800 \text{ nm}$ ) Ladungsträgerpaare erzeugt, so dass sich ein stationärer Strom einstellt. Der Absorptionskoeffizient der Materials beträgt  $\alpha = 1000 \text{ cm}^{-1}$ .

e) Berechnen Sie den Quantenwirkungsgrad  $\eta$  und die Empfindlichkeit (Responsivity)  $\mathcal{R}$  der Fotodiode. Welcher Strom stellt sich bei einer einfallenden Leistung von  $100 \mu\text{W}$  ein?

**Lösung:**

**Geg.:**  $P_e = 100 \mu\text{W}$ ,  $\lambda = 800 \text{ nm}$

**Ges.:** Wirkungsgrad  $\eta$ , Responsivity  $R$ , Strom  $I_L$

Die Empfindlichkeit wird mit  $\mathcal{R}$  bezeichnet, um Verwechslungen mit der Reflexion  $R$  an der Diodenoberfläche zu vermeiden. Es gilt:

$$\mathcal{R} = \frac{e}{\hbar\omega} (1 - R) \exp(-\alpha w_p) (1 - \exp(-\alpha w_i)) = 0.29 \frac{\text{A}}{\text{W}} \text{ und } \eta = \frac{\hbar\omega}{e} \mathcal{R} = 0.45$$

Somit fließt ein Strom von  $I_L = \mathcal{R} P = 29 \mu\text{A}$ .

## Aufgabe 2) Varaktordiode

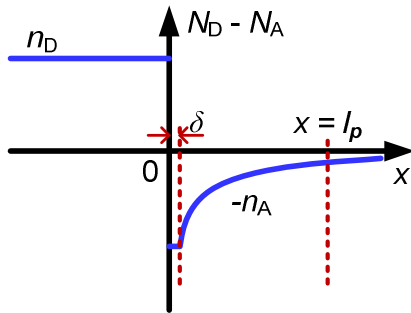


Fig. 2: Dotierprofil der Varaktordiode

$$N_D - N_A = \begin{cases} n_D & x < 0 \\ -K \cdot \delta^{-3/2} & 0 \leq x \leq \delta \\ -K \cdot x^{-3/2} & \delta < x \end{cases}$$

Eine in Sperrrichtung gepolte  $n^+p$ -Siliziumdiode wird als variable Kapazität in einer HF-Schaltung eingesetzt. Die Raumladungszone im p-dotierten Gebiet erstreckt sich bis zu  $x = l_p$ , wobei  $l = l_n + l_p$  die Länge der gesamten Raumladungszone bezeichnet. Die Länge  $l_n$  RLZ im  $n^+$ -Gebiet sei wegen  $n_A \gg n_D$

vernachlässigbar klein und es gilt  $l \approx l_p \gg \delta$ .

- a) Bestimmen Sie die ortsabhängige Feldstärke  $E(x)$  im Bereich  $\delta < x \leq l$ . Nutzen Sie dabei die Tatsache, dass das E-Feld außerhalb der Raumladungszone verschwindet, d.h.  $E(x) = 0$  für  $x > l$ .

### Lösung:

- 1) Aus der gegebenen Dotierung und der Vorgabe, dass sich die Raumladungszone im p-Gebiet bis  $x = l$  ausbreitet, können wir die Raumladung angeben. Unter Verwendung der Schottky-Näherung sind in der Raumladungszone keine Ladungsträger mehr vorhanden, also für  $0 < x < l$  gilt  $p(x) = 0$ . Zusätzlich wollen wir annehmen, dass Störstellenerschöpfung gilt, also  $n_A = n_A^+$ . Aus Gl. 6.17 können wir daher für die Raumladung im Bereich  $x > 0$  angeben ( $\delta \approx 0$ ):

$$\rho(x) = -en_A(x) = \begin{cases} -eKx^{-3/2}, & \delta < x < l \\ 0, & x > l \end{cases}$$

- 2) Aus den Maxwell'schen Gleichungen folgt der Zusammenhang zwischen dem

elektrischen Feld und der Raumladung (Gl. 6.18):  $\frac{dE}{dx} = \frac{\rho}{\epsilon_0 \epsilon_r}$

- 3) Durch Integration erhalten wir das E-Feld

$$E(x) = \frac{1}{\epsilon_0 \epsilon_r} \int \rho(x) dx = \frac{-eK}{\epsilon_0 \epsilon_r} \int x^{-3/2} dx = \frac{2eK}{\epsilon_0 \epsilon_r} x^{-1/2} + C, \quad \delta < x < l$$

- 4) Die Integrationskonstante  $C$  kann man aus der Randbedingung bestimmen, dass am Ende der Raumladungszone, also ab  $x = l$ , im Gleichgewicht das E-Feld verschwinden muss.

$$E(l) = \frac{2eK}{\epsilon_0 \epsilon_r} l^{-1/2} + C \stackrel{!}{=} 0 \quad \Rightarrow \quad C = -\frac{2eK}{\epsilon_0 \epsilon_r \sqrt{l}}$$

5) Damit ergibt sich das E-Feld zu 
$$E(x) = -\frac{2eK}{\epsilon_0 \epsilon_r} \left( \frac{1}{\sqrt{l}} - \frac{1}{\sqrt{x}} \right), \quad 0 < x < l$$

- b) Bestimmen Sie das ortsabhängige elektrische Potential  $\varphi(x)$  im Bereich  $\delta < x \leq l$ . Es soll  $\lim_{\delta \rightarrow 0} \varphi(\delta) = 0$  gelten. Zeigen Sie, dass für das Potential  $\varphi(l)$  am rechten Rand folgende Beziehung gilt:

$$\varphi(l) = -\frac{2eK}{\epsilon_0 \epsilon_r} \sqrt{l} \quad (1.1)$$

**Lösung:**

- 1) Das Potential  $\varphi(x)$  berechnet man durch die Integration über das E-Feld

$$\frac{d\varphi}{dx} = -E(x)$$

$$\Rightarrow \varphi(x) = -\int E(x) dx = \frac{2eK}{\epsilon_0 \epsilon_r} \int \left( \frac{1}{\sqrt{l}} - \frac{1}{\sqrt{x}} \right) dx = \frac{2eK}{\epsilon_0 \epsilon_r} \left( \frac{x}{\sqrt{l}} - 2\sqrt{x} \right) + D, \quad \delta < x < l$$

- 2) Die Integrationskonstante  $D$  wird aus der gegebenen Randbedingung  $\varphi(0) = 0$

bestimmt: 
$$\varphi(0) = D = 0$$

- 3) Daraus ergibt sich für das Potential am Rand der RLZ

$$\varphi(l) = \frac{2eK}{\epsilon_0 \epsilon_r} \left( \frac{l}{\sqrt{l}} - 2\sqrt{l} \right) = -\frac{2eK}{\epsilon_0 \epsilon_r} \sqrt{l}$$

- c) Das Potential am rechten Rand der Raumladungszone entspricht der Differenz zwischen der angelegten Spannung  $U$  und der Diffusionsspannung  $U_D$ ,  $-\varphi(l) = U_D - U$ . Berechnen Sie daraus die Sperrschichtkapazität  $C_s = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{A}{l}$  in Abhängigkeit von  $U_D - U$ .

**Lösung:**

Zur Berechnung der Sperrschichtkapazität muss die Länge der Raumladungszone in Abhängigkeit der angelegten Spannung bekannt sein. Aus der gegebenen Randbedingung

können wir ableiten:  $l = \left( \frac{\epsilon_0 \epsilon_r}{2eK} \right)^2 (U_D - U)^2$ . Daraus folgt für die Sperrschichtkapazität

$$C_s = \frac{(2eK)^2 A}{\epsilon_0 \epsilon_r} (U_D - U)^{-2}$$

- d) Berechnen Sie die Resonanzfrequenz eines Reihenschwingkreis bestehend aus einer Induktivität  $L$  und einer in Sperrrichtung vorgespannten Varaktordiode mit der Sperrschichtkapazität  $C_s$  in Abhängigkeit von  $U_D - U$ .

**Lösung:**

Für einen Reihenschwingkreis aus einer Induktivität  $L$  und einer Varaktordiode mit Kapazität  $C_s$  erhält man eine Resonanzfrequenz, die sich linear mit der angelegten Spannung  $U$  ändert:

$$\omega_r = \frac{1}{\sqrt{LC_s}} = \sqrt{\frac{\epsilon_0 \epsilon_r}{4Le^2 K^2 A}} (U_D - U) \propto (U_D - U)$$